

## اثر جهت و اندازه میدان مغناطیسی در بازپخت جریان DC-میدانی بر امپدانس مغناطیسی بزرگ

### **نوار آلیاژ آمورف $\text{Co}_{68.15} \text{Fe}_{4.35} \text{Si}_{12.5} \text{B}_{15}$**

خان احمدی، ایمان؛ روزمه، سید احسان

دانشکاه فیزیک دانشگاه کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی - روبروی پل هوایی، کاشان  
گروه فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

#### چکیده

در این مقاله تأثیر پارامترهای بازپخت (اندازه و جهت میدان مغناطیسی) در بازپخت جریان مستقیم و جریان مستقیم-میدانی در نوارهای آلیاژ آمورف  $\text{Co}_{68.15} \text{Fe}_{4.35} \text{Si}_{12.5} \text{B}_{15}$  بر امپدانس مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت. بیشینه مقدار درصد امپدانس مغناطیسی در بازپخت جریان مستقیم ۱۱۶.۲٪ در جریان ۶۰۰ میلی‌آمپر و ۱۵ دقیقه بازپخت و در بازپخت جریان مستقیم-میدانی، بیشینه مقدار درصد امپدانس مغناطیسی در ۶۰۰ میلی‌آمپر، میدان مغناطیسی عرضی ۶۰ اوستاد و حدود ۱۴۷.۴٪ به دست آمد.

The influence of magnetic field direction and amplitude in direct current-field annealing on the giant magnetoimpedance effect (GMI) of  $\text{Co}_{68.15} \text{Fe}_{4.35} \text{Si}_{12.5} \text{B}_{15}$  amorphous alloy ribbon

**Khanahmadi, Iman; Roozmeh, Seyed ehsan**

*Department of Physics, University of kashan, kashan,  
Department of Physics, kashan University, kashan*

#### Abstract

In this paper, the influence of annealing parameters (amount and direct of magnetic field) in DC current and DC current-field annealing was investigated in  $\text{Co}_{68.15} \text{Fe}_{4.35} \text{Si}_{12.5} \text{B}_{15}$  amorphous alloys ribbons for magneto impedance.

The maximum value of GMI ratio (about 116.2%) obtained for 600mA and 15 minutes in DC current annealing. This maximum was (about 147.4%) for 600mA, 60Oe transverse magnetic field in DC current-field annealing.

*Amorphous Alloys, DC Current -Field Annealing, Co-based, Magnetic Material.*

امپدانس مغناطیسی (MI) شامل تغییرات زیاد امپدانس مواد مغناطیسی نرم تحت اعمال میدان مغناطیسی یکنواخت است. این پدیده به طور گسترده در نوارهای کبالت پایه به دلیل داشتن میدان ناهمسانگردی نزدیک صفر بررسی شده است. ناهمسانگردی را می‌توان به وسیله کنترل شرایط بازپخت تغییر داد. نوارهای کبالت پایه به دلیل دارا بودن حوزه مغناطیسی برای

#### مقدمه

کشف اثر امپدانس مغناطیسی (MI) در سال ۱۹۹۴ [۱] باب تازه‌ای را در بررسی حسگرهای مغناطیسی دقیق گشود. اثر امپدانس مغناطیسی به عنوان یکی از خواص ترابرد مواد می‌تواند بیان کننده خواص ذاتی و همچنین خواص مغناطیسی مواد از جمله ناهمسانگردی، تنگش، پذیرفتاری، تشدید مغناطیسی و غیره باشد.

۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ میلی آمپر به مدت زمان ۱۵ دقیقه باز پخت داده شد. جریان بهینه باز پختی ۶۰۰ میلی آمپر به دست آمد که امپدانس مغناطیسی آن حدود ۱۱۶/۲٪ رسید. همچنین برای به دست آوردن بهینه راستا و اندازه میدان مغناطیسی اعمالی در حین باز پخت جریانی DC-میدانی، نمونه‌ها در حضور میدان مغناطیسی خارجی ۰/۵، ۱۰/۵، ۲۰، ۴۰، ۵۰ و ۸۰ اورستدی در حالتی که راستاهای مختلفی با محور طولی نمونه‌ها می‌ساختند، باز پخت داده شد. پس از ۱۵ دقیقه و قطع جریان باز پخت، سرد شدن نمونه‌ها در حضور میدان خارجی در حدود ۲ دقیقه انجام شد.

پس از بهینه‌سازی، برای اندازه‌گیری امپدانس، جریان متناوب ۸ میلی آمپر و فرکانس ۴ مگاهرتز توسط دستگاه مولد جریان متناوب به نمونه اعمال و اندازه‌گیری ولتاژ بهوسیله اسیلوسکوپ انجام شد. میدان مغناطیسی یکنواخت در جهت طولی و هم راستا با طول نوار بهوسیله سیم پیچ در بازه صفرتا ۱۰۸ اورستد اعمال شد. تغییرات به دست آمده در ولتاژ خروجی را در اسیلوسکوپ ثبت کرده و سپس از رابطه (۱) برای به دست آوردن منحنی درصد امپدانس مغناطیسی بزرگ برحسب میدان مغناطیسی اعمالی استفاده کردیم.

در این کار از میدان مغناطیسی زمین به علت کوچکی، همچنین با توجه به اندازه گیری تغییرات نسبی صرف نظر شده است.

### تحلیل و بررسی نتایج:

شکل ۱ بیشینه اثر امپدانس مغناطیسی، نمونه‌های باز پختی در محیط هوا با جریان مستقیم ۶۰۰ میلی آمپر در حضور میدان‌های مختلف مغناطیسی در راستاهای ۶۰، ۷۵، ۹۰ و ۱۰۵ درجه‌ی محور طولی نمونه‌ها را نشان می‌دهد. در این نمودارها  $\beta$  زاویه قرار گیری نوار در میدان مغناطیسی خارجی در هنگام باز پخت است.

برای بررسی بهتر اثر زاویه تابش و اندازه میدان مغناطیسی اعمالی در باز پخت جریان DC-میدانی برای امپدانس مغناطیسی بزرگ نوارهای آمورف کیالت پایه، نتایج آزمایش‌ها فوق در جدول ۱ ارائه شده است.

مشاهده اثر MI بسیار مناسب می‌باشد. القای حوزه‌های مغناطیسی را می‌توان بهوسیله کنترل شرایط باز پخت اعم از (نرخ باز پخت، مدت زمان حضور میدان و...) کنترل کرد. تغییر امپدانس الکتریکی رسانای حامل جریان متناوب با دامنه و فرکانس مشخص تحت تغییر میدان مغناطیسی استاتیکی خارجی، امپدانس مغناطیسی نامیده می‌شود [۱]. نسبت امپدانس مغناطیسی نمونه‌ها از رابطه (۱) به دست می‌آید:

$$GMI(\%) = \frac{\Delta Z}{|Z|} \times 100 = \frac{|Z(H)| - |Z(H_{max})|}{|Z(H_{max})|} \times 100$$

که در این رابطه  $Z(H)$  امپدانس مغناطیسی نمونه در میدان مغناطیسی یکنواخت،  $Z(H_{max})$  امپدانس مغناطیسی نمونه در حالت اشباع مغناطیسی است که راستای تمام دوقطبی‌های مغناطیسی ماده با راستای میدان اعمالی خارجی یکسو باشد. اثر MI مستقیماً به جریان متناوب گذارنده از نمونه، میدان استاتیکی اعمالی خارجی، نفوذپذیری مغناطیسی، مقاومت الکتریکی و فرکانس جریان عبوری بستگی دارد. منشأ اثر امپدانس مغناطیسی عمق پوسته یا اثر پوسته است که با رابطه  $\delta_m = \sqrt{\frac{2\rho}{\mu}}$  تعریف می‌شود. در این رابطه  $\delta_m$  عمق پوسته،  $\mu$  نفوذپذیری مغناطیسی،  $\rho$  مقاومت ویژه الکتریکی ماده و  $\mu$  فرکانس جریان متناوب می‌باشد [۲]، این پدیده کلاسیکی و بر اساس معادلات ماکسول و لاندایو-لیفشتز قابل توجیه می‌باشد [۱]. در باز پخت جریانی علاوه بر جریان یافتن گرما در نمونه، طبق قانون آمپر باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی پیرامونی می‌شود؛ اما وقتی جریان قطع و نمونه سرد می‌شود، میدان عرضی محو می‌شود. در باز پخت جریان DC-میدانی، گرما و میدان مغناطیسی داخل نمونه هر کدام به تهایی قابل کنترل هستند.

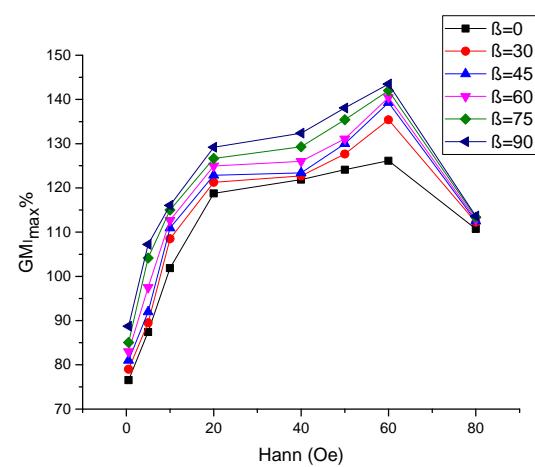
### روش تحقیق:

در این تحقیق نوار آمورف کیالت پایه با ترکیب  $Co_{68.15}Fe_{4.35}Si_{12.5}B_{15}$  در ابعادی با طول ۳۰ میلی‌متر، عرض ۰/۸۱ میلی‌متر و ضخامت ۲۸/۸ میکرومتر که به روش ذوب چرخان تهیه شده [۳]، مورداستفاده قرار گرفته است. برای به دست آوردن بهینه جریان باز پختی، نمونه‌ها در جریان‌های

بازپختی و ناحیه سوم، اثر امپدانس مغناطیسی کاهش می‌یابد. البته همچنان اندازه امپدانس از مقدار آن در میدان‌های بازپختی پایین، بیشتر است.

حال اگر به رفتار امپدانس نسبت به زاویه اعمال میدان مغناطیسی ضمن پخت دقت کنیم، مشاهده می‌کنیم که مستقل از مقدار میدان مغناطیسی، اثر امپدانس با افزایش زاویه، افزایش یافته و به بیشینه تغییر خود به ازای زاویه  $90^\circ$  درجه می‌رسد. افزایش یافتن اثر امپدانس مغناطیسی نمونه‌ها، زمانی که اندازه میدان مغناطیسی بازپختی ثابت انتخاب شده و زاویه‌ی میدان مغناطیسی بازپختی افزایش می‌یابد، با نتایج کارهای قبلی [۴] مطابقت خوبی دارد و حاکی از این است که سهم مؤلفه‌ی عرضی میدان مغناطیسی بازپختی، در بهینه کردن اثر امپدانس مغناطیسی نمونه بیشتر از سهم مؤلفه‌ی طولی میدان مغناطیسی بازپختی می‌باشد. بازپخت جریانی ساختار حوزه‌ای پیچیده‌ای القا می‌کند در حالی که حضور میدان مغناطیسی عرضی ضمن بازپخت ساختار حوزه‌ای عرضی القا می‌کند. رقابتی بین این دو القا در نمونه صورت می‌گیرد [۵].

تصور می‌کنیم که برای میدان‌های بازپخت کوچک، مکانیزم حرکت دیواره‌ها در روند مغناطش جسم غالب است. افزایش میدان ضمن بازپخت باعث القا ساختار حوزه‌ای عرضی می‌شود در این حالت عملأً حوزه‌ها هم راستا شده و سهم فراوانی به حرکت دیواره تعلق نمی‌گیرد. در این حالت نقش چرخش گشتاور مغناطیسی و نفوذپذیری عرضی به خصوص در فرکانس‌های بالا افزایش می‌یابد. در مجموع بازپخت جریان DC- میدانی باعث رقابت و گذار بین دو نوع القا ساختار مغناطیسی می‌شود. ساختار مغناطیسی پیرامونی به وسیله‌ی میدان ناشی از جریان بازپخت و ساختار مغناطیسی ناشی از میدان مغناطیسی خارجی اعمالی ضمن بازپخت می‌باشد. با استفاده از روش آزمایش مراجع [۶، ۷]، می‌توان رفتار نفوذپذیری مغناطیسی را به صورت تابعی از اندازه و زاویه‌ی تابش میدان بازپخت به دست آورد. به نظر می‌رسد که برای نمونه‌های بازپخت شده در حضور میدان مغناطیسی هم راستای محور طولی نوار آمورف، نفوذپذیری مغناطیسی طولی حاصله از حرکت دیواره حوزه‌ها (III)، با افزایش میدان بازپخت کاهش پیدا می‌کند،

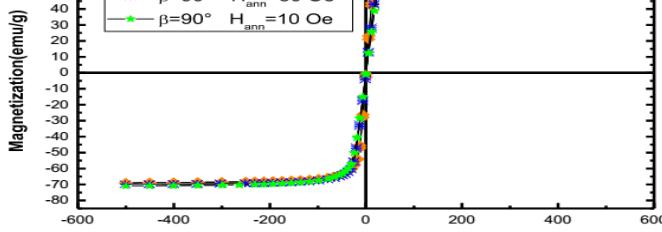


شکل ۱: بیشینه اثر امپدانس مغناطیسی اندازه‌گیری شده در فرکانس ۴ مگاهرتز و دامنه جریان ۸ میلی‌آمپر برای نمونه‌های بازپختی با جریان مستقیم ۶۰۰ میلی‌آمپر در حضور میدان‌های مختلف مغناطیسی در راستاهای ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۶۰، ۷۵ و ۹۰ درجه‌ی محور طولی نمونه‌ها.

جدول ۱: برخی پارامترهای مربوط به اندازه و زاویه میدان در بازپخت جریانی-میدانی با  $I_{\text{ann}} = 600 \text{ mA}$  و مدت زمان ۱۵ دقیقه و بیشینه مقدار GMI برای جریان اندازه‌گیری با مشخصات  $I_{\text{AC}} = 8 \text{ mA}$  و فرکانس  $f = 4 \text{ MHz}$

|        | ۸۰     | ۶۰     | ۵۰     | ۴۰      | ۲۰     | ۱۰     | ۵     | ۰/۵    | خام $H_{\text{ann}} (\text{Oe})$ | $\beta (^\circ)$ |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|----------------------------------|------------------|
| ۱۱۰/۷۲ | ۱۲۶/۱۵ | ۱۲۴/۱۱ | ۱۲۱/۸۸ | ۱۱۸/۷۰  | ۱۰۱/۸۰ | ۸۷/۴۲  | ۷۶/۰۰ | ۱۰۴/۱۶ |                                  | ۰                |
| ۱۱۲/۲۵ | ۱۳۵/۴  | ۱۲۷/۶۵ | ۱۲۲/۷  | ۱۲۱/۲۷  | ۱۰۸/۰  | ۸۹/۰۰  | ۷۹    | ۱۰۴/۱۶ |                                  | ۳۰               |
| ۱۱۲/۵۰ | ۱۳۹/۲۹ | ۱۲۹/۹۸ | ۱۲۲/۴  | ۱۲۲/۸۰  | ۱۱۰/۹۶ | ۹۱/۹۰  | ۸۱    | ۱۰۴/۱۶ |                                  | ۴۵               |
| ۱۱۲/۹۳ | ۱۴۰/۴۲ | ۱۳۱/۱  | ۱۲۶    | ۱۲۴/۹۶  | ۱۱۲/۶۶ | ۹۷/۵۰  | ۸۳    | ۱۰۴/۱۶ |                                  | ۶۰               |
| ۱۱۳/۲۲ | ۱۴۱/۹۸ | ۱۳۵/۴  | ۱۲۹/۳  | ۱۲۶/۶۶  | ۱۱۵/۰۱ | ۱۰۴/۱۴ | ۸۵/۰۳ | ۱۰۴/۱۶ |                                  | ۷۵               |
| ۱۱۳/۶۴ | ۱۴۳/۴۷ | ۱۳۸/۰۸ | ۱۳۲/۳۹ | ۱۲۹/۱۹۷ | ۱۱۶/۰۷ | ۱۰۷/۲۳ | ۸۸/۷۳ | ۱۰۴/۱۶ |                                  | ۹۰               |

از داده‌های جدول ۱ و رفتار منحنی‌های شکل ۱ می‌توان به نتایجی کلی دست یافت که به آن اشاره می‌کنیم. افزایش اثر امپدانس مغناطیسی با افزایش میدان مغناطیسی ضمن پخت به گونه‌ای است که تقریباً سه ناحیه را در بر می‌گیرد. در محدوده میدان‌های بازپخت پایین حداقل تا ۲۰ اورستد، افزایش اثر امپدانس مغناطیسی فراوان است. با افزایش این میدان، افزایش اثر امپدانس مغناطیسی کمی کاهش یافته اما همچنان رفتار افزایشی رادار است. این رفتار تا میدان مغناطیسی ۶۰ اورستد ادامه یافته و سپس با افزایش میدان



شکل ۲: منحنی مغناطیش نمونه های بازپخت شده در میدان های مختلف مغناطیسی و زاویه ثابت  $90^\circ$ .

### نتیجه گیری

اعمال میدان مغناطیسی خارجی ضمن بازپخت جریانی، می تواند به القاء ناهمسانگردی و تولید حوزه های عرضی کمک کند زیرا می توان بعد از پایان اعمال جریان تا سرد شدن نمونه همچنان میدان را اعمال کرد. دامنه و زاویه تابش میدان مغناطیسی در هنگام بازپخت جریان DC-میدانی نوار در بازپخت اهمیت دارد. با انتخاب شرایط بهینه در اندازه گیری اعم از اندازه و فرکانس جریان و بهینه پارامتر بازپخت همچون اندازه و جهت میدان بازپختی موجب می شود که اثر امپدانس مغناطیسی افزایش قابل توجهی داشته باشد.

### مرجع ها

- [۱] M. H. Phan and H. X. Peng, "Giant magneto impedance materials: Fundamentals and applications" *Progress in Materials Science*, Vol. 53, 2008, pp. 323–420.
- [۲] LV. Panina, K. Mohri, "Magneto-impedance effect in amorphous wires". *Appl Phys Lett.* 1994;65:1189–91.
- [۳] رضایی، محمدرضا؛ جزایری قرمباغ، علی؛ بختیاری، رضا. ساخت و مشخصه یافی نوارهای مغناطیسی آمورف Co-Fe-Si-B-(Ni,Mo). *Co-Fe-Si-B-(Ni,Mo)*. کنفرانس سالانه فیزیک، شهریور ۱۳۹۷، دانشگاه کاشان.
- [۴] R. Mardani, A. Amirabadizadeh, M. Ghanaatshoar and H. Farsi, "The influence of magnetic field direction and amplitude in direct current-field annealing on the magnetoimpedance of Co-Based wires," *J. Supercond. Nov. Magn.* vol. 28, no. 8, pp.2441-2446, 2015.
- [۵] M. Ghanaatshoar, M.M. Tehranchi, S.M. Mohseni, S.E. Roozmeh, A.Jazayeri Gharehbagh, *Effect of magnetic field-current annealing on the magnetoimpedance Of Co-based ribbons*, *J. Non-Crystalline Solids*.
- [۶] Manh-Huong Phan, Hua-Xin Peng, Michael R. Wisnom, Seong-Cho Yu, NguyenChau, *Valve behavior of giant magnetoimpedance in field-annealed Co<sub>70</sub>Fe<sub>5</sub>Si<sub>15</sub>Nb<sub>2.2</sub>Cu<sub>0.8</sub>B<sub>7</sub> amorphous ribbon*, *J. Appl. Phys.* **97** (2005).
- [۷] M.H. Phan, S.C. Yu, C.G. Kim, and M. Vazquez, *Appl. Phys. Lett.* **83** (2003) 2871
- [۸] M.H. Phan, H.X. Peng, M.R. Wisnom, S.C. Yu, C.G. Kim, N.H. Nghi, *Sensors and Actuators A*. **129** (2006) 62–65.

در حالی که نفوذپذیری مغناطیسی طولی حاصله از چرخش مغناطیش (H<sub>TOT</sub><sup>dw</sup>)، ابتدا با زیاد شدن میدان بازپخت به اندازه ۶۰ Oe، افزایش می یابد و سپس در میدان های بازپخت بالاتر از ۶۰ Oe، کاهش می یابد. با توجه به این که شکل هندسی نوارها باعث می شود دیواره حوزه ها مؤلفه بیشتری در راستایی طولی نوارها داشته باشند. به نظر می رسد که برای نمونه های بازپخت شده در حضور میدان مغناطیسی هم راستایی محور عرضی نوار آمورف، نفوذپذیری مغناطیسی ناشی از حرکت دیواره حوزه ها در راستای عرضی (H<sub>L</sub><sup>dw</sup>) ابتدا با زیاد شدن میدان بازپخت به اندازه ۶۰ Oe، افزایش می یابد و سپس در میدان های بازپخت بالاتر از ۶۰ Oe، کاهش می یابد. یا به عبارتی نفوذپذیری مغناطیسی طولی حاصله از چرخش مغناطیش (H<sub>TOT</sub><sup>dw</sup>)، ابتدا با زیاد شدن میدان بازپخت به اندازه ۶۰ Oe، افزایش می یابد زیرا نفوذپذیری مغناطیسی عرضی ناشی از حرکت دیواره حوزه با نفوذپذیری مغناطیسی طولی ناشی از چرخش مغناطیش متناسب است [۸].

$$\mu_T^{dw}(f) \propto \mu_L^{dw}(f) \quad (2)$$

از طرفی افزایش یا کاهش نفوذپذیری مغناطیسی عرضی ناشی از حرکت دیواره حوزه و نفوذپذیری مغناطیسی طولی ناشی از چرخش مغناطیش (H<sub>L</sub><sup>dw</sup>)، باعث افزایش یا کاهش اثر امپدانس مغناطیسی می شود؛ که کاملاً مطابق داده ها جدول است.

در شکل ۲ نتایج اندازه گیری منحنی های پسماند نمونه های بازپخت شده در میدان های مختلف مغناطیسی و زاویه ثابت  $90^\circ$  نشان داده شده است. از شکل (۲) می توان نتیجه گرفت که برای

نمونه های بازپخت شده در حضور میدان مغناطیسی هم راستایی محور عرضی نوار آمورف، نفوذپذیری مغناطیسی ناشی از حرکت دیواره حوزه ها در راستای عرضی (H<sub>L</sub><sup>dw</sup>) ابتدا با زیاد شدن میدان بازپخت به اندازه ۶۰ Oe، افزایش می یابد و سپس در میدان های بازپخت بالاتر از ۶۰ Oe، کاهش می یابد که استدلال های ارائه شده برای توجیه نتایج به دست آمده از آزمایش های فوق را تائید می کند.